

# 电阻率和霍耳系数的半自动测量系统

马金泉 王万年 何广平

(中国科学院半导体研究所)

对于半导体材料的电阻率和霍耳系数的测量，可以得到标志材料性能的几个重要参数，如电阻率、电子或空穴载流子浓度、霍耳迁移率、补偿度、禁带宽度以及杂质能级位置等。国内过去一直采用电位差计、检流计或数字电压表来测量电压、电流信号，然后再用计算尺或计算器算出它的结果<sup>[1]</sup>。此法太费事，不方便。

本工作采用一种新的系统来测量电阻率、霍耳系数等，能大大提高劳动效率、计算快而准确，减少了出错率。它的特点可以概括为以下几个方面：

1. 快速、准确、重复性好，而且比较直观。
2. 能够在测量中监视中间过程。
3. 不仅能打印出最后的结果，而且能记录中间的测试数据，并画出曲线以供参考。

## 一、测量目的、要求及实施

根据本系统的特点，我们利用“BASIC-IV”计算机对话式语言，编制了一个温度、电阻率和霍耳系数的测量程序<sup>[2]</sup>。下面简略地介绍一下这个程序的框图。

系统启动后，先将测量程序从磁盘输入到计算机的内存，然后执行。

首先要回答是否做变温测量？若不做则输入常温温度后跳过；否则，进行五次温度测量，再判断温度的稳定情况，若稳定则跳过，否则再重复上述操作，直到稳定为止。

从C点开始进行电压、电流测量。先输入样品的号码和类型。号码是指样品编号，以便打印记录或存储用。类型是指被测样品是什么半导体材料，以便正确地选取霍耳因子。

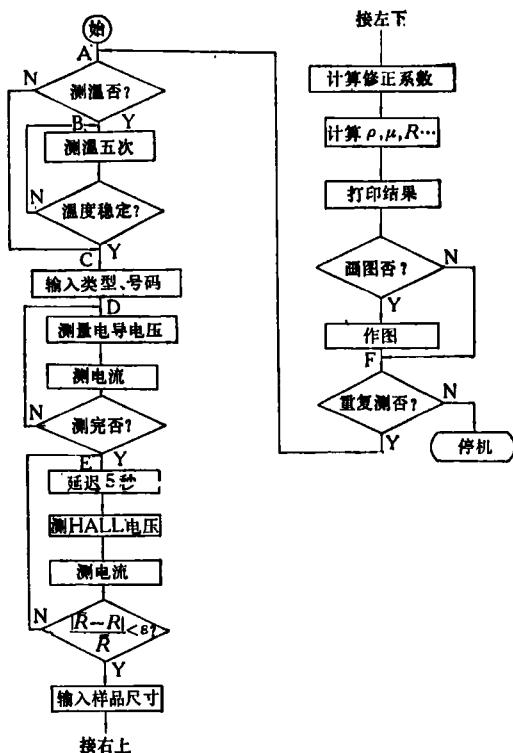


图 1

接着测量样品的电导电压和电流多次，包括电极的选择和电流的正反向，还要选择量程范围，采样速率等。判断是否测完，“未完”返回重测，否则进行下一个操作。

下一步测量样品的霍耳电压和电流，为了能在磁场稳定的情况下进行测量，各次测量之间要延迟五秒。同时计算出每次测量的偏差值与某个规定值进行比较。小于该值时，则通过，否则返回到E点重新测量后再判断。

在进行数据运算以前，要求输入样品尺寸、标准电阻阻值和磁场强度。对于片状样品，用范德堡法测量时，还要在程序中先算出修正系

数  $F$  值<sup>[3,4]</sup>。本系统  $F$  值的计算误差  $\leq 1 \times 10^{-5}$ 。根据上边测量和计算出的数值，算出电阻率、霍耳系数、杂质浓度及霍耳迁移率等参数。然后在打印机上打印出标题、日期、温度、样品号码后再打印出测量结果。

下一个操作是问是否画图？回答肯定时画图后到  $F$  点；否定时跳到  $F$  点做下一步。最后问你是否需要重复测量？肯定时，返回到  $A$  点；否则，程序运行完毕，停机。

## 二、仪器设备概述

### 1. 磁铁及其电源

有两种电磁铁，大的电磁铁做室温及液氮温度测量用。当磁间隙为 3.5 厘米时，磁场强度可达 7000 高斯。一般用 2000 高斯。小的为螺线管状电磁铁，通 1.4 安培的电流时，磁场强度为 1000 高斯，用于变温测量。

直流磁铁电源是我所自制的稳流源。电压为 0—130 伏，电流为 0—10 安培，稳定度为 1%。

### 2. 低温设备

采用我所自制的小型致冷机，它可以冷到液氮温度。我们在 13—300K 温度范围内进行测量。每次可测两片样品，约需 6 小时，消耗液氮 15 升。

### 3. 测温及控制设备

测温采用金铁-镍铬热电偶或铂电阻温度计。计算温度公式已编入到程序中，测出电压或电阻，就会得出温度值。

温控设备是用国产 DWT-702 型控制器改制成的，一般能控制到 0.1K。

### 4. 测量系统

数据采集和处理采用英国 Solartron 公司制造的 35 系统。可自编程序，多点采集。通过微处理机进行数据处理、终端显示、打印和画图。该计算机存储量为 32K，16 位字长，带有 BASAC-IV 语言。

## 三、测量结果

本测量系统与以前的方法测量出的数据相比较，两者基本一致。本系统的测量结果更接近真实值，测量精度也满足要求。测量误差估计值：电导电压小于 0.5%，霍耳电压小于 1%，电流小于 0.5%。

该系统的重复性也比较好，一般都在误差范围以内。我们用它做了多次低温变温测量，不但重复性好，而且计算出的能级位置也和国外发表的颇为一致，见图 2。

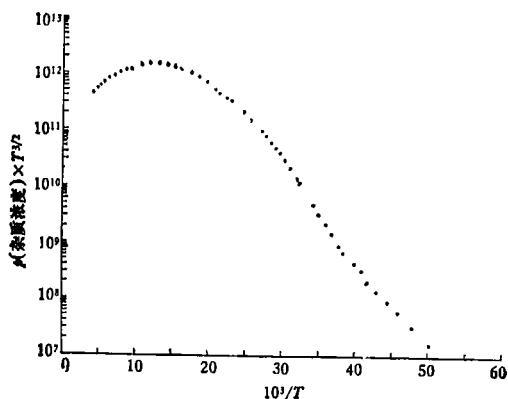


图 2

到目前为止，我们用该系统测了上千片样品，画了几十条变温曲线，并做了一些分析研究工作，发挥了它的作用。

本文曾得到许振嘉同志的指导和周远同志在低温方面的帮助，在此谨表衷心的感谢！

## 参 考 文 献

- [1] 周洁等，《物理学报》，22-4(1966), 404.
- [2] 藤定宏幸，《电子通信学会论文集》，J62-C-11 (1979), 748.
- [3] L. J. van der Pauw, *Philips Res. Reports*, 13-1 (1958), 1.
- [4] 中国科学院沈阳计算技术研究所等编，《电子计算机常用算法》，科学出版社，(1976), 304.